

中华人民共和国国家标准

GB/T 17444—2013 代替 GB/T 17444—1998

红外焦平面阵列参数测试方法

Measuring methods for parameters of infrared focal plane arrays

2013-11-12 发布 2014-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

目 次

前 言

本标准按照 GB 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 17444—1998《红外焦平面阵列特性参数测试技术规范》,与 GB/T 17444—1998 相比主要变化如下:

- ——标准名称修改为《红外焦平面阵列参数测试方法》。
- 一一增加了一些参数定义,如:红外焦平面阵列、像元、帧频、行频、固定图形噪声、平均峰值探测率、 饱和信号电压、像元噪声等效温差。
- ——增加一些参数测试方法,如:固定图形噪声、读出速率、帧频。
- ——增加了附录 D《调制传递函数测试方法》、附录 E《非线性度测试方法》。
- ——修改了部分参数的名称和定义,如:积分时间、读出速率、辐照功率、辐照能量、饱和辐照功率、 死像元、过热像元、噪声等效功率。
- ——修改了部分参数的测试方法,如:响应率、噪声电压、噪声等效温差、探测率、动态范围、相对光谱响应、串音。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由工业和信息化部电子工业标准化研究所归口。

本标准起草单位:中国科学院上海技术物理研究所。

本标准主要起草人:丁瑞军、梁平治、唐红兰、陈洪雷、曹妩媚、殷建军、陈世军。

本部所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 17444—1998。

红外焦平面阵列参数测试方法

1 范围

本标准对红外焦平面阵列特性参数及相关量进行了定义。

本标准给出了红外焦平面阵列特性参数的测试方法及测试条件。

本标准适用于线列和面阵红外焦平面阵列。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2. 1

红外焦平面阵列 infrared focal plane arrays; IRFPA

对红外辐照(以下简称辐照)敏感的探测器阵列并带有读出电路的器件,简称红外焦平面。

2.2

像元 pixel

红外探测器阵列的敏感单元。

2.3

帧周期 frame period

面阵红外焦平面一帧信号积分和读出所需要的时间。

2.4

帧频 frame frequence

面阵红外焦平面在1s时间内的信号输出帧数。

2.5

行周期 line period

红外焦平面一行信号积分和读出所需要的时间。

2.6

行频 line frequence

红外焦平面在1 s 时间内的信号输出行数。

2.7

积分时间 integration time

在帧周期或行周期内,红外焦平面累积辐照产生电荷的有效时间。

2.8

读出速率 pixel rate

红外焦平面像元信号读出的速率。

2.9

电荷容量 charge capacity

红外焦平面能容纳的最大信号电荷数。

2. 10

辐照功率 irradiation power

入射到一个像元上的总功率。